



## POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Angelika Timusk  
Riigihangete vaidlustuskomisjon  
vako@fin.ee

Teie 14.01.2025

Meie 17.01.2025 nr 20-1.3/174-4

Vandeadvokaat Mart Parind  
MOONRAY OÜ esindaja  
e-post: [mart.parind@nove.ee](mailto:mart.parind@nove.ee)

Baltic Fox OÜ  
e-post: [pavel.nordberg@balticfox.ee](mailto:pavel.nordberg@balticfox.ee)

### **Hankija vastus vaidlustaja täiendavatele seisukohtadele**

#### **1. Menetluse senine käik**

Riigihangete vaidlustuskomisjon (edaspidi VAKO) edastas 03.01.2025 Politsei- ja Piirivalveametile (edaspidi hankija) MOONRAY OÜ (edaspidi vaidlustaja) vaidlustuse riigihanke „IR lasersihikute soetamine“ (viitenumber 278422) 30.12.2024 otsusele nr 20-2.28/6-14, millega lükati mittevastavana tagasi MOONRAY OÜ pakkumus ning tunnistati edukaks Baltic Fox OÜ (edaspidi kolmas isik) pakkumus.

Hankija esitas 08.01.2025 vaidlustusele vastuse. 09.01.2025 teavitas VAKO menetlusosalisi edasistest menetlustähtaegadest ning vaidluse lahendamisest kirjalikus menetluses. 13.01.2025 teatas VAKO vaidlustaja päringu peale, et vaidlustuses esitatud menetluslikud taotlused ekspertiisi läbiviimiseks või selle läbiviimise võimaldamiseks jäävad rahuldamata. Vaidlustaja esitas oma täiendavad seisukohad 14.01.2025.

Käesolevaga vastab hankija vaidlustaja 14.01.2025 esitatud täiendavatele seisukohtadele.

#### **2. Hankija täiendav seisukoht**

Hankija jääb 08.01.2025 vaidlustuse vastuses esitatud seisukohtade juurde ning soovib tulenevalt vaidlustaja 14.01.2025 vastusest tuua välja veel järgmist:

##### **2.1. Vaidlustaja seisukohad ei kummuta fakti, et ruumi temperatuur valgustehnilise mõõtmise teostamise hetkel oli tehnilisele kirjeldusele vastav**

Vaidlustaja väitel on ilmne protokollrikkumine, kui vaidlustaja näidistoodet testiti ruumis, mille temperatuur oli  $25,2 \pm 1,0$  °C (ehk toatemperatuur võis olla ka 24,2 °C).

Tehnilise kirjelduse (edaspidi TK) koostamisel lähtus hankija EN standardist, millest lähtuvad ka laborid valgustehniliste mõõtmiste teostamisel. Vaidlustus selle osas, et mõõtemääramatuse arvestamine temperatuurilistel mõõtmistel on protokollrikkumine, on alusetu. Kui lähtuda vaidlustaja tõlgendusest, et TK punktis 31 toodud temperatuuri tuleb lugeda nii, et tegemist saab olla ainult sellise testkeskkonnaga, mille temperatuur on absoluutse täpsusega +25 kraadi, ei oleks võimalik hankijal isegi kõnealust laboritesti läbi viia, kuivõrd laborile etteantud mõõtemetoodika standardist tulenevalt on temperatuuri mõõtemääramatus paratamatu. Sisuliselt üritab vaidlustaja luua olukorda, kus hankijal ei ole objektiivselt võimalik seadmete vastavust mitte mingil juhul põhjapanevalt kontrollida. Nagu on ka hankija esialgses vastuses toodud – igasugusel mõõtmisel on paratamatu määramatus (sh ka temperatuuril). Isegi kui teha (või kui hankija oleks teinud) pakkuja näidisele samas (või teises) laboris kordusmõõtmine, ei oleks võimalik mõõtmist teostada ilma mõõtemääramatuseta.

Käsitledes konkreetselt testkeskkonna temperatuuri ( $25,2\text{ °C} \pm 1\text{ °C}$ ), tuleb seda tõlgendada järgmiselt: konkreetse keskkonna tõeline temperatuur jääb  $24,2\text{ °C}$ - $26,2\text{ °C}$  vahele. Kuivõrd absoluutselt täpset mõõtmist ei ole võimalik teostada, märgib hankija, et temperatuuri väärtust  $25,2\text{ °C}$  peetakse antud kontekstis testkeskkonna tõenäosimaks temperatuuriks. Mõõtemääramatus on kahe mistahes aktsepteeritava mõõteväärtuse võimaliku erinevuse kirjeldaja. Mõõtemääramatus kaasneb iga füüsikalise pidevsuure mõõtmisega. (I. Peil, K. Tarkpea. Sissejuhatus füüsikasse. Kulgliikumise kinemaatika. Peatükk 2.5.1: Mõõtmise täpsuspiirid ja mõõtemääramatus. <https://opik.fyysika.ee/index.php/book/section/240#/section/240>)

Jääb ebaselgeks, mida peab vaidlustaja silmas „pakkuja kasuks või kahjuks mõistmisega“ (vaidlustaja täiendavate seisukohtade p 11). Hankija väide on olnud, et (i) testimiskeskkonna temperatuurile kohaldub paratamatu määramatus, ning lisaks sellele (ii) ei mõjuta ka eksperdi sõnul temperatuuri paratamatu mõõtmatus käesolevas vaidlustuses relevantset määral mõõtmistulemust (seda kinnitavad faktiliselt ka testi käigus tehtud kordusmõõtmised). Eeltoodud tõsiasi ei saa tõlgendada või mõista ei pakkuja „kahjuks“ ega „kasuks“. Hankija ei ole kummalegi poole, ei vaidlustaja sõnutsi „plussi“ ega „miinuse“ suunas kaldunud. Sh kõnealuse mõõtmise käigus saavutatud tulemus vaidlustaja tootenäidise tipplaine pikkusest (818 nm) on mõõtemääramatusega  $\pm 1$  nm. Ka „pakkuja kasuks“ tõlgendamisel jääb tipplaine pikkuse näit TK punktis 29.3 nõutust madalamaks ( $845 \pm 25$ ).

Vaidlustaja on oluliselt võimendanud hankija väiteid ekstreemsete näidetega, väljudes käesolevas vaidluses küsimuse all olevate asjaolude mõistlikest piiridest. Nagu on ka selgelt esitatud hankija eelnevas vastuses, temperatuur ei mõjuta tulemust teatud piirides. Taaskord, ekstreemset temperatuurimuudatust (ja selle mõju) hankija oma vastuses eelnevalt käsitlenud ei ole. Testimise jooksul teostati korratud mõõtmisi, millega viidi mõõtmiste keskkonna ja mõõdetava seadme temperatuur (keskkonnaga stabiliseeritult) ka kümne kraadi võrra madalamale, ning see ei muutunud mõõdetavat parameetrit - tipplaine pikkus (*Peak Wavelength*)  $\lambda_p$  (muutus alla 1 nm). Mõõtmised kinnitasid seega ka asjaolu, et *Peak Wavelength*  $\lambda_p$  ei sõltu antud kontekstis seadme ja ümbritseva keskkonna temperatuurist (vt Lisa 1).

## **2.2. Vaidlustaja seisukohad ei kummuta fakti, et TK p 31 tingimuse kohaselt tuleb arvestada vaid testkeskkonna temperatuuriga**

Tehnilisest kirjeldusest ei loe välja vaidlustaja väidetut, et temperatuuritingimus peaks hõlmama seadme temperatuuri (vaidlustaja täiendavate seisukohtade p 12 ja 13), tegu on

vaidlustaja enda paljasõnalise hinnanguga. Hankijal tekib vaidlustaja seisukohast tingituna ka küsimus, mida tähendab vaidlustaja hinnangul „seadme temperatuur“ ning kas seda oleks võimalik üldse objektiivselt ja terviklikult mõõta. Seadme komponendid on juba oma toimimismehhanismi olemusest tulenevalt eri temperatuuridega (nt seadme IR-kiirguri keskpunkt ning seadme välikorpus). Seega jääb hankija jätkuvalt seisukohale, et TK-s on *temperatuuritingimusena* käsitletud vaid seadet ümbritsevat keskkonda. Nagu on toodud ka hankija eelnevas vastuses: seadme sisu (optilise seadme ehk laseri) temperatuuri mõõtmine ei ole tehnoloogiliselt võimalik ilma seadet lahti monteerimata.

Keskkonna ja seadme töötemperatuur avaldab eelkõige mõju IR-kiirgurite intensiivsusele (võimsusele), mitte tiplaine pikkusele. Seda on kinnitanud hankija eelnevas vastuses nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tehnikaülikooli (edaspidi „TTÜ“ või „labor“) eksperdid. IR-kiirgurite intensiivsus (võimsus) on vahetus seoses energiaallikaga. Vaidlustajal puudub alus eeldada, et enne seadme testimist on seda hoitud külmades/kuumades tingimustes. Sh tuleb arvestada, et mõõteprotokollil näol on tegemist standardprotokolliga, kus märgitakse protseduuriliselt olulisi andmeid. Hankija ei nõustu seisukohaga, mille kohaselt mõõteprotokollil seadme temperatuurilise seisukorra täpsustuse lisamata jätmine muudab mõõtmise ebapädevaks ja selle tulemusena saavutatud näidud ebausaldusväärseks.

Kui jõuda seisukohale, et tingimus tuleb tõlgendada pakkuja kasuks (isegi kui selle tingimuse täitmine oleks eluliselt võimatu ning seda ei saa mõistlikult hankijast eeldada), peab hankija vajalikuks selgitada mõõtemetoodikat, mida on TTÜ mõõteprotokollis kasutatud. TTÜ mõõtemetoodika põhineb standardil EVS-EN 13032-1:2004+A1:2012 Lampide ja valgustite fotomeetriliste andmete mõõtmine ja esitamine. Osa 1: Mõõtmine ja failiformaat. Eelnimetatud standardi kohaselt toimub mõõtmine järgmiselt: „Mõõtmisi ei tohi alustada enne, kui valgusallikas on fotomeetriselt stabiliseerunud. Valgustugevuse mõõtmised tuleb sooritada vähemalt üks kord minutis 15 min kestel. Ükski lugemipaar ei tohi erineda enam kui 1% võrra miinimumist. Igal juhul tuleb saavutada iga katsetatava valgusallika elektriline ja fotomeetiline stabiilsus; ka kasutatav liiteseadis peab olema termilises tasakaalus.“ Kasutatav mõõteprotseduur näeb seega ette, et mõõtmisel kasutatakse üksnes stabiliseeritud (valgus)kiirgusallikaid. Samuti kasutatakse mõõtevahendeid, mis on mõõdetavate parameetrite mõõtmiseks sobivad ning omavad vähimat mõju mõõtemääramatuse tekkeks (vt Lisa 1). Seega stabiliseeritakse seade testkeskkonnale vastavaks. Stabiliseerimine tähendab, et seade on keskkonnas piisavalt pikaajaliselt, et teatud intervalliga testimise tagant annab seade täpselt samasuguse testitulemuse nagu varemgi. Vastasel juhul ei ole võimalik teostada ka kordusmõõtmisi ega saavutada usaldusväärset testitulemust.

Hankija ei ole käesolevas vaidlustusmenetluses kordagi väitnud, et ei vastuta hankes tehtavate otsuste õigsuse eest (nagu on vaidlustaja viidanud oma täiendavate seisukohtade punktis 7). Hankija on nii vaidlusaluses otsuses kui ka vastuses vaidlustusele kinnitanud, et näidise valgustehnilise mõõtmise teostamise ajendiks TTÜ-s on olnud hankija enda visuaalne kontroll. Kuivõrd hankijal endal ei ole akrediteeritud laborit valgustehnilise mõõtmise teostamiseks, ei ole hankijal muudmoodi võimalik näidise tiplaine pikkust kontrollida, kui lastes mõõtmise teostada teisel asutusel. Seega tuleb vaidlustus jätta rahuldamata, kuna vaidlustaja pakkumust ei ole võimalik vastavaks tunnistada ning vaidlusalune otsus on õiguspärane.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Lysann Viitamees  
arendusosakond, hanke- ja lepingutalitus,  
lepingute grupp  
jurist

Lisa:  
Lisa 1 - TTÜ selgitused hankija täiendavatele küsimustele

Lysann Viitamees, 6123195, lysann.viitamees@politsei.ee